## MEASUREMENT OF THE LONGITUDINAL PHASE-SPACE DISTRIBUTION IN THE HIGH-BRIGHTNESS ELECTRON BUNCH

Ryukou Kato<sup>1</sup>, Shigeru Kashiwagi, Yutaka Morio, Yoshikazu Terasawa, Kenichiro Furuhashi, Goro Isoyama Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, 567-0047

#### Abstract

In order to measure the longitudinal phase-space profile of the electron beam, we are developing the measurement system consisted of a Cherenkov radiator, a bending magnet and a streak camera. The Cherenkov radiator with an aerogel was installed in the beam transport line, and a preliminary longitudinal phase-space image was reconstructed from energy sliced images

# 高輝度電子バンチ内の縦方向位相空間分布測定

## 1.はじめに

Self-Amplified Spontaneous Emission (SASE)の 発生に用いられる高輝度電子ビームは、複数回のバ ンチ圧縮により、数kAのピーク電流を有するよう になる。このバンチ圧縮過程はバンチ内の電子の位 置とそのエネルギーに影響を与える。さらにこの高 いビーム電流により加速管内にはウェーク場と呼ば れる電磁波が誘起される。このウェーク場が加速管 内の加速電場に重ねあわされることにより、電子は 正弦波から大きく歪んだ加速電場を経験することに なる。結果的に高輝度電子バンチ内の電子はより複 雑な縦方向位相空間分布を持つようになる。これま でのところ、縦方向位相空間を直接観測する手段は なく、電子バンチの時間プロファイルとエネルギー 分布は独立に評価されてきた。最近、縦方向位相空 間を評価するために、いくつか手法が提案され研究 が進められている1-4。

大阪大学産業科学研究所では、偏向電磁石、プロ ファイル・モニタ、ストリークカメラを組み合わせ て縦方向位相空間モニタの開発を行っている。予備 実験では可視遷移放射(OTR)モニタを用いて、ビー ム・プロファイルを測定した。OTRプロファイルか らビーム・エネルギーを評価した結果、通常使用し ている運動量分析電磁石とスリット、ファラデー カップを用いたエネルギー評価システムよりも高い 運動量分解が得られた<sup>5</sup>。しかし、OTRによる発生光 子数が少ないことに加えて、我々が行っているTHz 領域でのSASEやFEL実験<sup>6-7</sup>で使用する10-20 MeVの電 子ビーム・エネルギーではOTRの角度分布拡がりが 大きく、縦方向位相空間分布を評価するのに十分な 光量を得ることができなかった。光子数を増加させ るためにPITZ<sup>2</sup>での実験結果を参考に、プロファイ ル・モニタとしてシリカ・エアロジェルからのチェ レンコフ光を用いることにした。

この論文ではエアロジェル・チェレンコフを用い た縦方向位相空間測定の最初の実験結果について報 告する。

2. チェレンコフ・モニタの設計

設置場所の物理的な制限のため、私たちは複雑な メカニズムを真空中に構築することができなかった ので、図1に示されているように、金属鏡で支持さ れた簡単なチェレンコフ発光部を設計した。この チェレンコフ発光部では、疎水性シリカエアロジェ ル(SP-50、松下電工製)を使用している。45x30mm2 で厚さ1.5mmの薄いエアロジェルはアルミニウム金 属鏡に取り付けられている。このエアロジェルの屈 折率と密度は各々1.05と0.19g/cm3である。チェレ ンコフ放射は、開き角2θ<sub>cR</sub>のコーン状に放射され、 この角度は媒質中での平均屈折率nと粒子の速度βに より以下の式で決定される:



Figure 1: Schematic design of the Cherenkov radiator.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: <u>kato@sanken.osaka-u.ac.jp</u>



Figure 2: Screen folder mounted with both of a ceramic screen and a Cherenkov radiator. The left screen is a profile monitor with a fluorescence ceramic screen with a thickness of 0.1 mm and it is tilted vertically by an angle of  $45^{\circ}$ . The right screen is the aerogel radiator and it is tilted of  $55.8^{\circ}$ .

$$\cos\theta_{CR} = \frac{1}{\beta n} \,. \tag{1}$$

10 MeVの以上のエネルギーの電子に対して、放射 角度はほぼ一定であり、その開き角は35.5である。 放射されたすべての光を集光するには、この角度拡 がりが大きすぎるので、我々はチェレンコフ光の一 部を使用することにした。エアロジェルの中で放射 されたチェレンコフ光は、金属鏡で反射され、再び エアロジェルの中を通って、真空との間の境界面で 屈折される。エアロジェルの中で上向きに放たれた チェレンコフ放射が真空中で水平面に対し垂直方向 に放射されるように、チェレンコフ発光部は55.8° の傾き角で取り付けられている。これにより、エア ロジェルの実効的な厚さは2.7mmになる。チェレン コフ光円錐の一部が、サファイア真空窓を通して真 空槽から大気中に取り出され、反射鏡によりスト リークカメラまで輸送される。最初の凹面鏡によっ て輸送される光は、おおよそ全放射の10 %と見積も られる。媒質中で電子が距離dだけ進む時に、 $\lambda_l$ か ら $\lambda_2$ の波長範囲に放射される光子数 $N_{CR}$ は、以下の ようになる:

$$N_{CR} = 2\pi\alpha d \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) \sin^2 \theta_{CR}, \qquad (2)$$

ここでaは微細構造定数である。エアロジェルの 400nmから800nmまでの波長範囲の平均透過率が85% であると仮定すると、最初の反射鏡が受け取る光子 数は1入射電子あたり1.2個と推定される。チェレン コフ放射により発生する光子数は、0TRのそれより も2桁以上大きい。

図2は、チェレンコフ発光部を取り付けたスク リーンフォルダーの写真を示している。同じ位置で ビーム・プロファイルを測定するために、0.1 mmの 厚さの蛍光セラミック・スクリーン(AF995R、 Desmarquest社製)がビーム軌道面に対し45°傾けて



Figure 3: Configuration of the Cherenkov radiator.

エアロジェルの横に取り付けられている。

#### 3.実験配置

チェレンコフ・プロファイルモニターは、図3に 示されているように、ライナックからFELシステム までビーム輸送路に設置された。プロファイルモニ ターと偏向電磁石の間の距離は320mmで、この位置 における分散関数は0.4mである。エアロジェルの実 際の可視幅が40mmであるので、エネルギーアクセプ タンスとエネルギー分解能は各々10%と0.25%/mmで あると見積もられる。

エアロジェルで発生する光は、約15mの光輸送路 のより大気中を加速器室から測定室まで輸送され、 ストリークカメラにより測定される。ストリークカ メラは入射スリット上での光パルス像を、空間情報 を水平軸に、時間情報を縦軸もつストリーク像に変 換する。ストリークカメラとしてはC5680-11(浜松 ホトニクス社製)が使用される。C5680-11はHigh Speed Streak Unit C5676との組み合わせで1.57ps の時間分解を持っている。ストリークカメラの有効 面積はスクリーン上で11(H)x8.25(V) mm<sup>2</sup>である。 そこで、エアロジェル上での発光像がその領域に適 合するように光輸送システムを用いて調整する必要 がある。しかし光輸送路がまだ完成していなかった ので、既存の反射鏡を用いて仮設の光輸送路を構築 した。その結果、像の増倍率と輸送路の輸送効率は 最適化されておらず、ストリークカメラから見込め るエアロジェルの水平サイズは4.4mmに制限される。 (この幅は、1.1%のエネルギーアクセプタンスに対 応する)。したがって、縦方向位相空間内の電子分 布の全体像を1度に取得することが出来ず、1.1%の エネルギー幅でスライスされた像が得られる。した がって、今回は、偏向電磁石の磁場を掃引すること により得られる複数のエネルギースライスされたイ

メージを結合させることにより、縦方向位相空間像 を復元した。

### 4.実験結果

図4に、実験に使用された単バンチ電子ビームの エネルギー・スペクトルに示す。電子バンチは、2 台の108MHz空洞と1台の216MHz空洞で構成されるサ ブハーモニックバンチャー(SHB)システムを備えた 1.3 GHz Lバンド電子ライナックで加速された。こ のSHBシステムにより、最大90 nC以上の電荷量をも つ高輝度電子バンチの発生が可能になる。他方、こ のSHBシステムを用いて発生した単バンチビームは 縦方向の電子位置とそれらのエネルギーとの間によ り複雑な相関関係を持つことになる予想される。

図5は、3つの異なる加速位相の場合に、電磁石電 流を0.05Aまたは0.1Aステップで変えながら測定さ れたスライスイメージから復元された縦方向位相空 間を示している。図中のプロファイルは、水平軸と して時間情報を縦軸としてエネルギー情報をもって いる。左側が電子バンチの先頭を示している。図4 に示されているエネルギー・スペクトルは、図5(b) に対応している。図5の(a)と(c)は、(b)を基準にし て-10°と+10°の加速位相で測定された。(a)と(c) のプロファイルでは、先頭からテールまで単調なエ ネルギー増加か、エネルギー減少の傾向がある。し かしながら、より詳細に見ると、異なったエネル ギーの電子が同じ位相に存在するのを見ることがで きる。特に(b)では、電子は縦方向位相空間内で、 より複雑な分布をしている。電子バンチによって引き起こされたウェーク場が、加速電場に重なるので、 電子は正弦波と比較して歪んだ電場を経験すること になる。ウェーク場を用いてこれらのプロファイル を説明するのは、定性的に可能であると考えられる。

## 5.まとめ

電子ビームの縦方向位相空間を測定するために、 エアロジェルを用いたチェレンコフ・モニタ、偏向 電磁石、およびストリークカメラから成る測定シス テムを開発した。仮設の光輸送路を用いてエネル ギースライスされた縦方向位相空間像を測定し、ス ライスイメージからの縦方向位相空間プロファイル を復元した。

#### 謝辞

本研究の一部は科学研究費補助金(基盤研究 (C)18540273、2006-2008)によりサポートされてお ります。

## 参考文献

- [1]A. Doria et al., Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A 475, (2001) 296.
- [2] J. Rönsch et al, FEL'06, BESSY, Berlin, Germany, August 2006, p.597.
- [3] H. Loos et al, FEL'05, Stanford, August 2005, p.632.
- [4] S. Zhang et al, FEL'05, Stanford, August 2005, p.640.
- [5] R. Kato et al, FEL'06, BESSY, Berlin, Germany, August 2006, p.676.
- [6] R. Kato et al, Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A 445 (2000) 167.
- [7] R. Kato et al, Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A 475 (2001) 334.



Figure 5: Reconstructed longitudinal phase-space profiles of the single bunch electron beam for three different accelerating phases. The profile images have temporal information as the horizontal axis (150 ps / full scale) and energy one as the vertical (9.6 % or 2.6 MeV / full scale). The left side indicates the head in the electron bunch. Accelerating phases of the bunch center are estimated to (a) -20  $^{\circ}$ , (b) -10  $^{\circ}$  and (c) 0  $^{\circ}$  from the rf crest, respectively.